

晶圆级元器件测量

是德科技与 Cascade Microtech

可靠的配置、安装和支持可以确保精确的可重复的晶圆级元器件测量

确保测试系统技术指标满足放大器、混频器和滤波器等元器件的晶圆级测量要求十分困难，包括多种类型元器件的单一晶圆无疑会进一步增加测量难度。验证元器件需要执行广泛且复杂的测试，包括 S 参数、直流参数、噪声系数、增益压缩和互调失真等。测量和校准精度非常重要，关联多个地点的测试结果时尤其需求精确的校准。

配置系统以应对上述测量挑战必须指定和购买多家供应商的仪器、晶圆探头台、射频与直流探头以及软件，然后集成硬件与软件并在测试第一个器件前现场验证测试系统。您可能需要数周甚至数月的时间才能信心十足地执行测量，并确保不同地点的数据相关联以及测量精度。

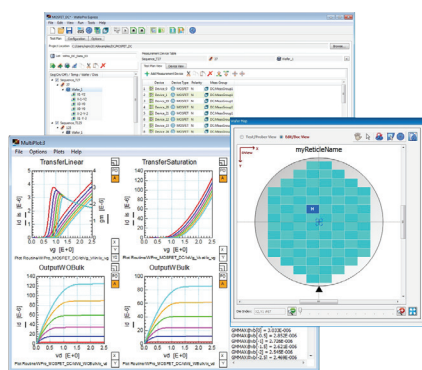
是德科技与 Cascade Microtech 提供集成晶圆级元器件测量系统以及保证的配置、安装和支持，能够帮助您应对挑战。Cascade Microtech 出色的晶圆级探测台、微波与直流偏置探头和工具，结合是德科技的测试仪器以及测量与分析软件，能够提供覆盖所有元器件的全面测量。

典型晶圆级元器件测量系统包括 Keysight PNA 或 PNA-X 微波网络分析仪、N6705B 直流功率分析仪和 Keysight WaferPro Express (WaferPro-XP) 测量软件平台，以及 Cascade Microtech Summit 或 Elite 半自动晶圆探测台与 300mm Infinity 晶圆探头、WinCal XE 校准软件和阻抗标准基片 (ISS) 校准。

- 精确、可重复的晶圆级元器件测量
- 预先验证的系统配置
- 遵循预定标准的安装
- 单点支持联系
- 解决方案专家提供优化建议
- 保证的系统配置、安装与支持



晶圆级元器件测量



测量自动化是生产与研发领域保证效率和精度的关键。WaferPro-XP 支持您快速设置并执行自动晶圆级测量。WaferPro-XP 的界面和 workflows 已针对 Cascade Microtech 半自动探头台进行优化。

为确保所有组件和集成系统满足客户应用需求，Cascade Microtech 与是德科技在交付产品前都会预先验证系统配置。Cascade Microtech 解决方案专家负责安装、训练和验证系统 S 参数以及直流参数性能，是德科技解决方案专家负责验证可选应用功能。

系统安装将完全遵循协商一致的验收标准。并且，客户只需联系 Cascade Microtech 即可获得全面的支持，进而快速解决发现的问题。此外，Cascade Microtech 和是德科技组建了晶圆级测量解决方案专家团队，可以与客户共同优化系统，以契合客户持续变化的元器件测量要求。

Cascade Microtech 与是德科技提供保证的配置、安装与支持，能够确保晶圆级元器件测量系统满足您的测试精度以及可重复性要求，从而快速且信心十足地展开第一次测量，并关联不同地点的测量数据。

系统组件

是德科技

N52xx	PNA 微波矢量网络分析仪
N6705B	直流功率分析仪
WaferPro-XP	测量软件平台

Cascade Microtech

Summit 12000	200mm 半自动晶圆探测台
Elite 300	300mm 半自动晶圆探测台
WinCal XE	校准软件
Infinity 探头	晶圆探头 500 GHz
ISS	阻抗标准基片 (ISS) 校准标准

如欲了解该解决方案如何满足您的特定需求，请联系是德科技解决方案合作伙伴 Cascade Microtech:

www.keysight.com/find/cascade



是德科技 & 解决方案合作伙伴

扩展解决方案，满足独特需求

是德科技及其解决方案合作伙伴携手，致力于帮助客户应对设计、制造、安装或支持领域的独特挑战。了解是德科技解决方案合作伙伴计划以及合作伙伴与解决方案的更多信息，请访问 www.keysight.com/find/solutionspartner

Cascade Microtech 是精密接触和电气测量与测试行业的全球领导者，其解决方案覆盖集成电路 (IC)、光学器件及其他微型器件等众多应用领域。

www.cascademicrotech.com

如欲了解是德科技的产品、应用和服务信息，请访问:

www.keysight.com

本文中的产品指标和说明可不经通知而更改
© Keysight Technologies, 2014
Published in USA, August 4, 2014
出版号: 5991-4494CHCN
www.keysight.com